

## 상 세 규 격 서

구분	품명	단위	수량	비고
1	1 $\mu\text{m}$ SiO <sub>2</sub> Step metal coated and mounted on Metal	ea	3	
2	5 $\mu\text{m}$ Si Step metal coated, mounted on Metal	ea	3	
3	10 $\mu\text{m}$ Si Step, metal coated, mounted on Metal	ea	3	
4	25 $\mu\text{m}$ Si Step, metal coated, mounted on Metal	ea	3	

### 상 세 내 역

#### 1. 구성

1. 1  $\mu\text{m}$  SiO<sub>2</sub> Step metal coated and mounted on Metal
2. 5  $\mu\text{m}$  Si Step metal coated, mounted on Metal
3. 10  $\mu\text{m}$  Si Step, metal coated, mounted on Metal
4. 25  $\mu\text{m}$  Si Step, metal coated, mounted on Metal

#### 2. 구성

1. 1  $\mu\text{m}$  SiO<sub>2</sub> Step metal coated and mounted on Metal

- Height : 1  $\mu\text{m}$
- Our multipurpose Nanuler Calibration Standard is designed for calibration of AFM, SEM, Optical and Mechanical Profilers
- Features include step heights, lines, grids, magnification box and spot measurement structures of different pitch
- The features are etched into SiO<sub>2</sub> and Si and are optionally available with metal coating for improved reflectivity and reduced static charge

2. 5  $\mu\text{m}$  Si Step metal coated, mounted on Metal

- Height : 5  $\mu\text{m}$
- Our multipurpose Nanuler Calibration Standard is designed for calibration of AFM, SEM, Optical and Mechanical Profilers
- Features include step heights, lines, grids, magnification box and spot measurement structures of different pitch
- The features are etched into SiO<sub>2</sub> and Si and are optionally available with metal coating for improved reflectivity and reduced static charge

3. 10  $\mu\text{m}$  Si Step, metal coated, mounted on Metal

- Height : 10  $\mu\text{m}$
- Our multipurpose Nanuler Calibration Standard is designed for calibration of AFM, SEM, Optical and Mechanical Profilers
- Features include step heights, lines, grids, magnification box and spot measurement structures of different pitch
- The features are etched into  $\text{SiO}_2$  and Si and are optionally available with metal coating for improved reflectivity and reduced static charge

#### 4. 25 $\mu\text{m}$ Si Step, metal coated, mounted on Metal

- Height : 25  $\mu\text{m}$
- Our multipurpose Nanuler Calibration Standard is designed for calibration of AFM, SEM, Optical and Mechanical Profilers
- Features include step heights, lines, grids, magnification box and spot measurement structures of different pitch
- The features are etched into  $\text{SiO}_2$  and Si and are optionally available with metal coating for improved reflectivity and reduced static charge

### 3. 기타사항

가. 설치위치 : 경북 구미시 구미대로 350-27 XR 디바이스 개발 지원센터 106호

나. 설치개요 : 규격서의 조건에 맞는 광학 물품 납품

다. 납품기한 : 계약일로 부터 30일 이내

라. 계약의 이행

- 1) 본 규격서에 대한 주계약자(이하 “계약자” 라 한다)와 발주기관 간의 해석상 이견은 발주기관의 해석에 따라야 하며, 본 규격서에 특별히 명시되지 않은 사항은 정부계약법 등의 규정과 일반 관례에 따른다.
- 2) 발주기관은 계약내용 전부에 대한 권리를 행사할 수 있으며 계약자는 이에 대하여 전적으로 동의해야 한다.
- 3) 본 규격서에 명시된 모든 조항은 본 사업의 원활한 추진에 필요한 최소한의 사항만을 규정하였으므로 상세히 기술하지 않았거나 누락된 사항에 대해서도 정상운영 및 서비스에 문제가 발생되지 않도록 계약자는 사전 조치를 취하여야 한다.
- 4) 본 규격서에서 요구하는 성능 및 특성에 대해 계약자의 오인 또는 누락된 상태로 계약 체결되어, 계약 후 이를 보완하기 위한 설계 변경, 물품 등을 추가해야 할 경우 계약자 부담으로 시행한다.
- 5) 계약자는 공급하는 제품의 성능, 품질 등에 대한 최종적인 책임을 진다.

#### 4. 기타조건

가. 납품기한 : 계약 후 30일 이내

다. 규격관련 문의사항 : 강필성 선임 : 010-4261-0006